



SERVICIO DE MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO

SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN

SOLICITUD DE ANÁLISIS

TÉCNICO RESPONSABLE: Pilar Posadas Bernal

pposadas@ictp.csic.es

USUARIO/ SOLICITANTE: Nombre y apellidos:

Extensión

Correo-e:

AFILIACIÓN

ICTP

CSIC

OPIs

UNIVERSIDAD

EMPRESA

Instituto / Centro

Investigador responsable:

Proyecto / Código

Número de muestras solicitadas

Fecha de terminación, dd/mm/aa

Fecha de solicitud, dd/mm/aa

Número de muestras realizadas

Tipo de análisis:

- SEM convencional alto vacío
- SEM modo ambiental (MEBA)
- SEM - EDX
- Metalización

Comentarios:

Riesgos:

(Volatilidad,
termoestabilidad,
toxicidad)